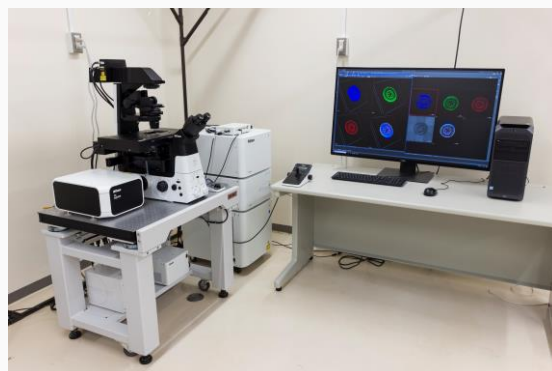




光・電子相関顕微鏡システムが設置されました。

光・電子相関顕微鏡システム

光・電子相関顕微鏡システムが遺伝子実験施設西棟1階W8a号室に2021年11月に新規に設置されました。光・電子相関顕微鏡 (Correlative Light and Electron Microscopy; CLEM)では、共焦点レーザー顕微鏡 (Nikon AX) と透過電子顕微鏡 (JEM-1400Flash) または走査電子顕微鏡で同じ試料を観察し、両者から得られる情報を連携させることが可能です。



新規設置

共焦点レーザー顕微鏡 (Nikon AX)



新規設置

透過電子顕微鏡 (JEM-1400Flash)

主な仕様：エネルギー分散型X線分析器
3次元トモグラフィー
走査透過電子顕微鏡機能

試料作製装置

凍結切片作製装置

- ・クライオウルトラミクロトーム (Laica EM UC7)

コーティング装置

- ・オートファインコーター (JEC-1600)



移設 走査電子顕微鏡 (JSM-7100F)

府中新2号館101号室→遺伝子実験施設西棟W8a

電子顕微鏡担当者 紹介

電子顕微鏡の専門家である新分 成人 (しんぶん なるひと) 氏が、透過電子顕微鏡・走査電子顕微鏡担当の専門技術職員として2021年8月、透過電子顕微鏡担当として森本 建吾 (もりもと けんご) 氏が2022年2月にそれぞれ赴任されました。

電子顕微鏡利用の方は窓口担当 skawai@cc.tuat.ac.jp および ymatsu@cc.tuat.ac.jp までお問合せ下さい。